



云南大学学报(自然科学版) » 2003, Vol. 25 » Issue (6): 515-517 DOI:

物理学、材料科学

[最新目录](#) | [下期目录](#) | [过刊浏览](#) | [高级检索](#)

[◀ Previous Articles](#) | [Next Articles ▶](#)

TPP-1型椭偏谱仪测膜厚的探讨

吴永汉¹, 李艳峰², 吴兴惠²

1. 云南大学, 物理系, 云南, 昆明, 650091;
2. 云南大学, 材料科学与工程系, 云南, 昆明, 650091

Investigation on the type of TPP-1 the ellipsometer for measuring the thickness of thin films

WU Yong-han¹, LI Yan-feng², WU Xing-hui²

1. Department of Physics, Yunnan University, Kunming 650091, China;
2. Department of Material Science and Engineering, Yunnan University, Kunming 650091, China

- [摘要](#)
- [参考文献](#)
- [相关文章](#)

全文: [PDF \(592 KB\)](#) [HTML \(KB\)](#) 输出: [BibTeX](#) | [EndNote \(RIS\)](#) [背景资料](#)

摘要 说明原椭偏谱仪不能直接测量膜厚,提出外加波长片后可以测量膜厚的2种方法.

关键词: [椭圆偏振](#) [薄膜厚度](#) [位相差](#)

Abstract: It is shown that the conventional ellipsometer can not be used to measuring the films' thickness.To solve this problem,it is suggested thst two kinds of methods for measuring the thickness of thin films by addition of filter wavelength leaf.

Key words: [ellipsometer](#) [the thickness of thin films](#) [phase difference](#)

收稿日期: 2003-03-11;

基金资助:国家自然科学基金资助项目(50162002)

引用本文:

吴永汉,李艳峰,吴兴惠. TPP-1型椭偏谱仪测膜厚的探讨[J]. 云南大学学报(自然科学版), 2003, 25(6): 515-517.

WU Yong-han,LI Yan-feng,WU Xing-hui. Investigation on the type of TPP-1 the ellipsometer for measuring the thickness of thin films[J]. , 2003, 25(6): 515-517.

没有本文参考文献

没有找到本文相关文章

服务

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [E-mail Alert](#)
- ▶ [RSS](#)

作者相关文章

- ▶ [吴永汉](#)
- ▶ [李艳峰](#)
- ▶ [吴兴惠](#)

版权所有 © 《云南大学学报(自然科学版)》编辑部

编辑出版: 云南大学学报编辑部 (昆明市翠湖北路2号, 650091)

电话: 0871-5033829(传真) 5031498 5031662 E-mail: yndxxb@ynu.edu.cn yndxxb@163.com